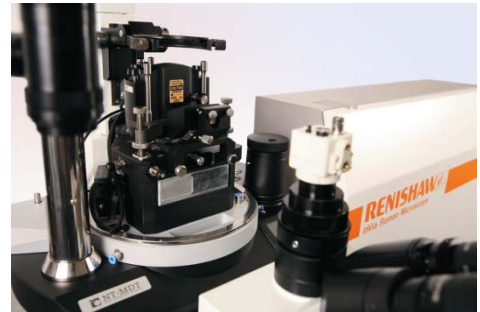


機器分析・計測セミナー
AFM ラマンシステムが可能にする世界
～異なる2つの分析手法の融合が生み出す新しいナノ解析～

試料と探針の原子間にはたらく力を検出して画像を得る原子間力顕微鏡（AFM）は原子・分子レベルの分解能で物質の表面構造を観察することができます。また、ラマン分光法は分子の構造や状態を知るための非破壊分析法として利用されています。近年、両装置を統合した機器が市販され、サブミクロンオーダーの空間分解能でのラマン測定と、AFMの同時測定による高精細な化学組成分析が簡便に実施できるようになりました。

当施設では最新の機器を紹介するため、開発メーカーから講師をお招きし、各測定方法の基礎と統合機種ならではの特徴と応用分析事例をご紹介するセミナーを企画しました。是非ともこの機会に最先端の測定技法に触れてみてください。

多数のご来聴をお待ちいたしております。



日時：平成23年11月16日(水)13:30～15:30

場所：富山大学 工学部管理棟2階 大会議室（富山市五福 3190）

定員：70名

講師：日本カンタム・デザイン株式会社 先端技術部 片倉 大輔 氏
西川 洋太 氏

申込方法：メールのみの受付【締切：11月9日(水)】

添付の申込書にご記入の上、メールに添付してお申し込みください。

申込先・問合せ先：

富山大学 自然科学研究支援センター機器分析施設

機器分析・計測セミナー担当

E-mail: cia00@ctg.u-toyama.ac.jp

TEL: 076-445-6715、6825